附件：

会议日程安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
| 5月18日 9：00~12：00，14：00~17：00 |
|  | 工信厅科函[2020]181号[2020-0720T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07062020) | 六氯乙硅烷中杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 审定 | 750919794 |
|  | 国标委发[2020]37号20202892-T-469 | 硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
| 5月19日 9：00~12：00，14：00~17：00 |
|  | 工信厅科函[2020]181号[2020-0718T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT07052020) | 碳化硅单晶中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司 | 审定 | 380285365 |
|  | 国标委发[2020]37号20202829-T-469 | 半绝缘碳化硅单晶的电阻率非接触测试方法 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 审定 |
| 5月20日 9：00~12：00，14：00~17：00 |
|  | 国标委发[2021]19号20211953-T-469 | 流化床法颗粒硅 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 审定 | 439581254 |
|  | 国标委发[2019]40号20194174-T-469 | 电子级多晶硅 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 审定 | 413633571 |